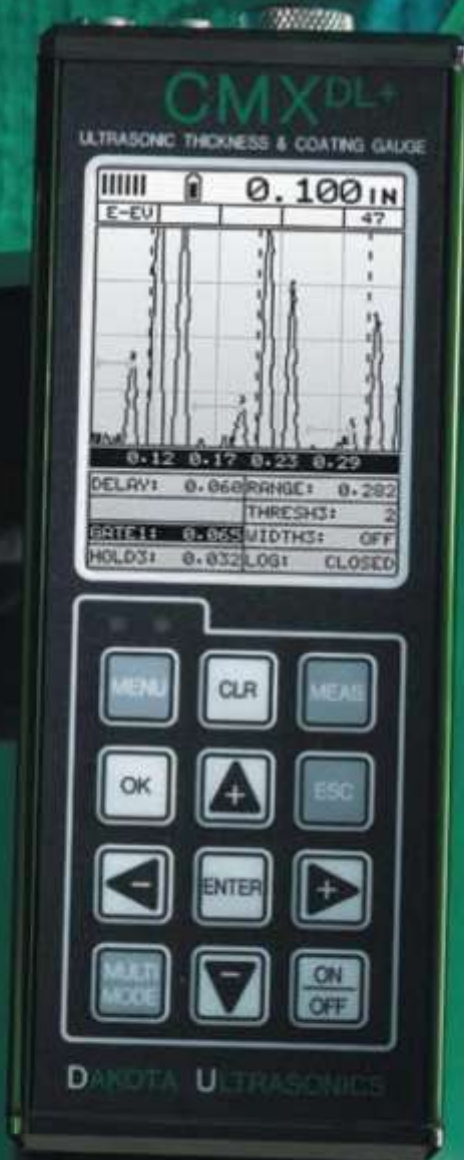


CMXDL+ v2.0

美国 DAKOTA 公司
A/B 扫描多功能超声波测厚仪



性能全面的便携测厚仪

- ▶ 100MHz FPGA 时序电路设计
- ▶ 可选彩色和灰度显示屏
- ▶ A/B 扫描
- ▶ 手动调节增益和自动增益控制 (AGC), 范围: 110dB
- ▶ 自动时间相关增益(TDG)
- ▶ 多种测量模式
 - 脉冲-回波(P-E)模式:
测量材料厚度
 - 脉冲-回波涂层(PECT)模式:
同时测量材料和涂层厚度
 - 脉冲-回波温度补偿(PETP)模式:
测量材料厚度
 - 回波-回波(E-E)模式:
穿过涂层测量材料厚度
 - 回波-回波验证(E-EV)模式:
穿过涂层测量材料厚度
 - 测量涂层(CT)模式:
只测量涂层厚度
- ▶ 双晶探头和单晶探头(延迟块、接触式、笔形)
- ▶ USB Type-C 数据接口
- ▶ 内置 4GB SD 存储卡

技术参数

测量

- 脉冲-回波(P-E)模式测量范围:
0.63mm ~ 30.48m(钢)
- 脉冲-回波涂层(PECT)模式测量范围:
0.63mm ~ 30.48m(钢), 0.0254~2.54mm(涂层)
- 脉冲-回波温度补偿(PETP)模式 测量范围:
0.63mm ~ 30.48m(钢)
- 回波-回波(E-E)模式测量范围:
2.54 ~ 152.4mm(钢, 穿过涂层测量, 范围取决于涂层)
- 回波-回波验证(E-EV)模式测量范围:
2.54 ~ 102mm(钢, 穿过涂层测量, 范围取决于涂层)
- 测量涂层(CT)模式测量范围:
0.0127~2.54mm(涂层)
- 分辨率: 0.01mm 和 0.001mm
- 声速范围: 309.88 ~ 18542m/s
- 单位: 公制或英制
- 一点和两点校准方式

显示

- 显示屏: 1/8 英寸 VGA 灰度显示, 240x160 像素。
- 可视区 62x45.7mm, EL 背光, 20Hz 刷新频率
可选 1/4 英寸彩色显示屏, 320x240 像素
可视区 43.2x57.6mm, 60Hz 刷新频率
- A-扫描方式: 检波+/- (缺陷视场), RF(全波视场)
纵向和横向视图(仅彩屏)
- B-扫描方式: 基于时间的横截面视图。
显示速度为每秒 10 到 200 个读数
- 大数字方式: 标准厚度显示, 数字高度 17.78mm(灰度)
14.35mm(彩屏)
厚度条形扫描: 速度 10Hz, 在 B-扫描和大数字显示模式中可见
- 稳定度指示: 表示测量值的稳定性
- 功能状态指示: 显示当前激活的功能

超声波参数

- 测量模式: P-E、PECT、PETP、E-E、E-EV、CT 模式
- 脉冲: 可调方波脉冲发生器
- 接收: 根据选择模式采用手动调节增益或自动增益控制 (AGC), 范围: 110DB
- 阻抗 50~1500Ω 可调
- 计时: 单次 100MHz 8 位超低功耗数字化仪的精确 TCXO 计时
- 脉冲重复频率: 250Hz

探头

- 频率范围: 1~20MHz
- 双晶探头
- 延迟块、接触式、笔形单晶探头
- LEMO 接口, 1.2 米探头线
- 可定制用于特殊应用的探头

存储

- 容量: 内置 4GB SD 卡
- 数据结构: 网格(字母数字)和顺序(自动识别)
- 截屏功能: 位图图形捕获, 用于快速记录

其他

- 键盘: 12 个触摸键
- 电源: 标配为三节 5 号碱性电池, 电量状态指示。
无操作五分钟后自动关机。USB Type-C 供电
- 外壳: 挤压铝机壳, 底盖用镀镍铝板加密封垫封装
- 工作温度: -10 ~ 60°C
- 尺寸: 63.5x165x31.5mm
- 重量: 385g(包括电池)
- 符合 NIST 和 MILSTD-45662A 标准

探头参数

探头型号	频率	探头尺寸	说明
PT-102-2900	5MHz	晶片 Ø6.35mm, 防磨面 Ø9.53mm, 测量范围 1.0~152.4mm	高阻抗双晶探头(标配探头)
PT-402-5507	15MHz	晶片 Ø6.35mm	单晶延迟块探头
PT-4023-2855	5MHz	晶片 Ø6.35mm	单晶接触式探头